

证书号第3976718号



发明专利证书

发明名称：一种测量弱磁性 $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ 外延薄膜层状磁结构的方法

发明人：韩景智;李鑫;张雄祚;杨金波;刘顺荃

专利号：ZL 2019 1 0437786.6

专利申请日：2019年05月24日

专利权人：北京大学

地址：100871 北京市海淀区颐和园路5号

授权公告日：2020年09月08日

授权公告号：CN 110212084 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第 3976718 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 05 月 24 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京大学

发明人：

韩景智；李鑫；张雄祚；杨金波；刘顺荃